日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2003年 3月25日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-083192

[ST. 10/C]:

[J P 2 0 0 3 - 0 8 3 1 9 2]

出 願 人
Applicant(s):

富士通株式会社

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2003年12月11日

今井康



【書類名】 特許願

【整理番号】 0241859

【提出日】 平成15年 3月25日

【あて先】 特許庁長官 太田 信一郎 殿

【国際特許分類】 C01B 31/02

C23C 16/26

【発明の名称】 カーボンナノチューブ成長方法

【請求項の数】 10

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 富士通

株式会社内

【氏名】 川端 章夫

【特許出願人】

【識別番号】 000005223

【氏名又は名称】 富士通株式会社

【代理人】

【識別番号】 100077517

【弁理士】

【氏名又は名称】 石田 敬

【電話番号】 03-5470-1900

【選任した代理人】

【識別番号】 100086276

【弁理士】

【氏名又は名称】 吉田 維夫

【選任した代理人】

【識別番号】 100092624

【弁理士】

【氏名又は名称】 鶴田 準一

【選任した代理人】

【識別番号】 100082898

【弁理士】

【氏名又は名称】 西山 雅也

【選任した代理人】

【識別番号】 100081330

【弁理士】

【氏名又は名称】 樋口 外治

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 036135

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9905449

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 カーボンナノチューブ成長方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 成長室内に基材を配置し、原料ガスを供給してCVD法により基材上にカーボンナノチューブを配向成長させる方法であって、カーボンナノチューブの成長に、電界及びプラズマのいずれも用いず、且つ成長室内に配置したフィラメントの発する熱を利用することを特徴とするカーボンナノチューブ成長方法。

【請求項2】 カーボンナノチューブ成長時の前記フィラメントの温度を4 00℃以上とする、請求項1記載のカーボンナノチューブ成長方法。

【請求項3】 前記フィラメントとしてレニウム製又はレニウムを主成分と する材料製のフィラメントを使用する、請求項1又は2記載のカーボンナノチュ ーブ成長方法。

【請求項4】 成長室内における前記原料ガスの全圧を $0.1\sim100$ k P a とする、請求項1 から3 までのいずれか一つに記載のカーボンナノチューブ成長方法。

【請求項5】 基材表面に形成した薄膜又は微粒子状のカーボンナノチューブ成長触媒を使用する、請求項1から4までのいずれか一つに記載のカーボンナノチューブ成長方法。

【請求項6】 前記触媒として前記微粒子状の触媒を使用し、その直径により成長するカーボンナノチューブの直径を制御する、請求項5記載のカーボンナノチューブ成長方法。

【請求項7】 カーボンナノチューブの成長前に、前記基材上に形成した前 記微粒子状の触媒を前記成長室内において反応性ガスの存在下でアニール処理し て、微粒子状触媒から不純物を除去する、請求項6記載のカーボンナノチューブ 成長方法。

【請求項8】 カーボンナノチューブ成長時に前記フィラメントと前記基材の一方又は両方を相対的に移動させる、請求項1から7までのいずれか一つに記載のカーボンナノチューブ成長方法。

【請求項9】 前記基材が半導体又はガラス基板である、請求項1から8までのいずれか一つに記載のカーボンナノチューブ成長方法。

【請求項10】 カーボンナノチューブ成長時の前記基板の成長面温度を600℃以下とする、請求項1から9までのいずれか一つに記載のカーボンナノチューブ成長方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、カーボンナノチューブの成長方法に関する。

[0002]

【従来の技術】

カーボンナノチューブの製造法としては、アーク放電法、レーザー蒸発法、熱 CVD法、プラズマCVD法などが知られている。アーク放電法、レーザー蒸発 法によるカーボンナノチューブでは、良質のカーボンナノチューブが得られると は言え、カーボンナノチューブの配向や長さを制御することは困難である。

[0003]

配向や方向の制御を可能にする方法として、熱CVD法やプラズマCVD法が挙げられる。これらの方法では、成長中に電界を印加することで、カーボンナノチューブを配向成長することが可能である。電界を印加しない場合の配向成長が、Nature, Vol. 416, pp495-496(2002)に掲載されているが、成長温度が800℃以上の高温であるため、この技術により半導体回路上にカーボンナノチューブを成長するのは不可能である。また、Chemical Physics Letters, 360(2002),pp229-234で550℃でのカーボンナノチューブの成長が報告されたが、成長方向の制御は実現できない。

[0004]

熱CVD法を利用したカーボンナノチューブのいろいろな製造方法が特許文献に記載されている。例えば、特開平9-31757号公報には、CVD法によりグラファイトナノチューブを低温度で作製する方法が開示されており、グラファ

イトナノチューブは650~800℃で作製されている。特開平10-2038 10号公報には、比較的低温で基体上にカーボンナノチューブを成長させる技術 が記載されており、この成長には直流グロー放電によるプラズマが必要とされて いる。特開平11-139815号公報には、原料ガスの熱分解反応によるカー ボンナノチューブデバイスの製造方法が記載されている。特開2001-303 250号公報には、熱CVD法を使用してカーボンナノチューブを基板上に垂直 配向する方法が記載され、この方法では成長時にDC電圧が印加される。

[0005]

これらの熱CVD法によるカーボンナノチューブの製造方法で、電界のような補助的手段を用いない場合、一般に500℃以上の成長温度が使用されている。

[0006]

一方、ホットフィラメントを利用するCVD法(ホットフィラメントCVD法)も知られている。特開2000-353467号公報には、冷陰極装置の製造においてホットフィラメントCVD法によりダイヤモンドあるいはダイヤモンドライクカーボンの電子放出材料を形成することが記載されている。カーボンナノチューブの製造には言及されていない。特表2002-518280号公報には、ホットフィラメントCVD法によるカーボンナノチューブの成長方法が記載されている。この方法では、成長に際し電界が印加されている。

[0007]

このように、これまでのホットフィラメントCVD法でのカーボンナノチューブの製造においては、補助的手段として電界の印加が行われている。

一方、ホットフィラメントCVD法によりカーボンナノチューブを1600 のフィラメント温度で成長することが、Chemical Physics Letters, 342 (2001), pp259-264に記載されている。

[0008]

【特許文献1】

特開平9-31757号公報

【特許文献2】

特開平10-203810号公報

【特許文献3】

特開平11-139815号公報

【特許文献4】

特開2001-303250号公報

【特許文献5】

特開2000-353467号公報

【特許文献6】

特表2002-518280号公報

【非特許文献1】

Nature, Vol. 416, pp495-496 (2002)

【非特許文献2】

Chemical Physics Letters, 360(2002), pp 229-234

【非特許文献3】

Chemical Physics Letters, 342 (2 001), pp 259-264

[0009]

【発明が解決しようとする課題】

本発明の目的は、これまで使用されてきた電界(あるいはプラズマ)等の補助 的手段に頼ることなく、低い温度で配向成長したカーボンナノチューブを製造で きる新しい方法を提供することであり、それにより、例えば、高温処理が許され ない半導体回路上へのカーボンナノチューブ成長を可能にすることである。

[0010]

【課題を解決するための手段】

本発明によるカーボンナノチューブ成長法は、成長室内に基材を配置し、原料ガスを供給してCVD法により基材上にカーボンナノチューブを配向成長させる方法であって、カーボンナノチューブの成長に、電界及びプラズマのいずれも用いず、且つ成長室内に配置したフィラメントの発する熱を利用することを特徴と

5/

する方法である。

ホットフィラメントを使用することにより、比較的低い温度、具体的には50 0℃未満の基材成長面温度でも、カーボンナノチューブを配向成長させることが できる。

[0011]

【発明の実施の形態】

本発明のカーボンナノチューブ成長法では、成長室内に配置したフィラメントをCVD法によるカーボンナノチューブ成長のための熱源として使用する。このような加熱用フィラメント(ホットフィラメントと呼ばれる)を利用するCVD法は、ホットフィラメントCVD法として知られているが、これをカーボンナノチューブの成長法に使用したものは1600Cのフィラメント温度を必要としていた(Chemical Physics Letters, 342(2001),pp259-264)。

[0012]

ホットフィラメントは、通電により発熱する。カーボンナノチューブ成長時のフィラメント温度は400℃以上とするのが好ましい。400℃未満では、原料ガスを分解するエネルギーを供給するのに不十分である。一方、フィラメント温度を不必要に上昇させるのはエネルギーの浪費であり、そのため一般には400~1000℃のフィラメント温度を用いるのが好ましい。フィラメント温度は、より好ましくは400~600℃、更に好ましくは400~500℃である。

[0013]

ホットフィラメントは、カーボンナノチューブ成長時の高温(400℃以上) に耐えることができ、且つ原料ガスやその分解生成物と化学反応しないかしにく い材料から製作すべきである。発明者は、炭素源を含む原料ガスからカーボンナ ノチューブをCVD法により製造する目的には、レニウム製又はレニウムを主成 分とする材料製のフィラメントを用いるのが好適であるのを見いだした。

[0014]

図1に示したように、ホットフィラメント12は、原料ガスが供給される真空 チャンバ (反応チャンバ) 10内に、成長基材14と対向して配置される。フィ ラメント12と基材14との間隔は、カーボンナノチューブ成長条件(使用原料ガスの種類、成長速度など)に応じて決定される。

[0015]

成長時には、ホットフィラメント12が基材14上を移動するようにして、任意の範囲にカーボンナノチューブを均一に成長させることができる。位置を固定したホットフィラメント12に対し、基材14の方を移動させてもよい。あるいは、ホットフィラメント12と基材14の双方が相対的に移動するようにしてもよい。移動の様式としては、例えば回転式、往復式などが可能である。例えば図1において、フィラメント12が水平方向に往復移動し、基材14が基材ステージ16の動きにより上下方向に移動するようにすることができる。フィラメント12は例えば交流電源18に接続され、基材ステージ16には一般に基材加熱手段(図示せず)が装備される。

[0016]

カーボンナノチューブ成長の原料には、炭素を含有する炭素源ガスを使用する。炭素源ガスとしては、メタン、エタン、アセチレン、プロパン、ブタンなどの炭化水素ガス、あるいはメタノール、エタノールなどのアルコール類のガスを用いることができる。2種以上の炭素源の混合物も使用可能である。

[0017]

原料ガスは、炭素源のほかに、水素のような反応性ガスと、ヘリウム、アルゴン等の不活性ガスの一方又は両方を含んでもよい。

[0018]

成長室内における原料ガスの全圧は、0.1~100kPa程度でよい。0. 1kPaより低い圧力ではカーボンナノチューブの成長速度が低くなり、100kPaを超えると原料ガスが成長室外に漏れ出す危険がある。原料ガスの全圧は、0.1~10kPaがましく、0.3~10kPaが更に好ましい。

[0019]

カーボンナノチューブを成長させる基材表面には、成長反応の触媒となる物質が必要である。触媒としては、遷移金属のFe、Ni、Co、Pdなどを使用することができ、それらのうちの2種以上のものの合金も使用可能である。そのよ



うな触媒となり得る遷移金属と、触媒とならない金属との合金、例えばFe-Pt、Co-Ptなどの合金、を用いてもよい。

[0020]

触媒は、成長基材表面において薄膜を形成してもよく、あるいは基材表面に分散した微粒子であってもよい。微粒子触媒の場合には、微粒子の直径を制御することにより成長するカーボンナノチューブの直径を制御することが可能である。例えば、下記の実施例に示されるように、直径が約7nm及び4nmの微粒子触媒を使用して、それぞれ直径が約15nm及び8nmのカーボンナノチューブを得ることができた。

[0021]

薄膜触媒の形成は、任意の方法で行うことができる。例えば、蒸着やスパッタ 法などが使用可能である。薄膜の厚さは任意に選定することができる。一方、微 粒子触媒の形成は、レーザーアブレーションや溶液反応などを利用して行うこと ができる。溶液反応を使用する場合には、形成した微粒子の周りにカーボン等の 不純物が付着していることがある。不純物は、一般に500℃以上の高温で熱処理することにより蒸発して消失するが、この熱処理だけでは不純物を完全に除去できない場合がある。このような場合には、例えば水素などの反応性ガスを使用するアニール処理により、残留不純物を除去することができる。このアニール処理は、成長時の温度圧力条件と同じかあるいはそれらに近い条件で行うことができることから、カーボンナノチューブの成長を始める前に成長室内で行うことができ、そしてそれに続いて同じ成長室内でカーボンナノチューブの成長を行うことができる。

[0022]

本発明では、ホットフィラメントの使用によりカーボンナノチューブを比較的 低温で配向成長させることができる。本発明の方法によれば、カーボンナノチュ ーブを得るのに基材成長面の温度は600℃以下で十分であり、500℃未満の 基材成長面温度でも十分である。

[0023]

カーボンナノチューブを成長させる基材としては、一例として、シリコンに代

8/

表される半導体の基板を用いることができる。上述のように基材表面温度は比較 的低くすることができるので、例えばガラス基板などのように従来のCVD法で はカーボンナノチューブの成長基材として用いることが困難であった材料の基材 を採用することも可能である。

[0024]

本発明によりカーボンナノチューブを製造するには、成長基材を収容しそして 原料ガスを供給してCVD法により基材上にカーボンナノチューブを配向成長さ せる装置であって、成長室内にホットフィラメントを備えた装置を使用する。

[0025]

【実施例】

Ē,

次に、実施例により本発明を更に説明するが、本発明はこれらの例に限定されるものではない。

[0026]

(実施例1)

図2(a)に示したように、シリコン基板20の上に触媒用のNi薄膜22を蒸着法により形成し、その上に直径2 μ mの開口を持つSiN絶縁膜24(厚さ500nm)を形成した。Ni薄膜22の膜厚は任意に決定できるが、ここでは2nmとした。この基板を反応部(真空チャンバ)(図示せず)に導入し、基板温度を500℃とした。アルゴンとアセチレンを80対20の割合で混合した原料ガスを100ccmの流量で反応部に供給し、真空ポンプに通じる排気系での制御により反応部の全体ガス圧を1kPaに調整した。基板上にホットフィラメント(レニウム製)を移動し、基板との間隔を約6mmとして、8A程度の電流を流した。これによりホットフィラメント温度は800℃に上昇する。この状態を1分間維持した後、ホットフィラメントへの通電を停止し、反応部内の残留原料ガスを真空排気して、基板を取り出した。図2(b)に示したように、基板面から垂直方向に約2 μ mの長さのカーボンナノチューブ26が形成された。

[0027]

(実施例2)

図3(a)に示したように、シリコン基板30上に形成したSiN絶縁膜34

(厚さ500 n m) の直径 2μ mの開口内に、レーザーアブレーション法により直径 7 n mの F e 微粒子膜 3 2 を形成した。この基板を反応部に導入して基板温度を 4 0 0 ∞ とした。アルゴンとアセチレンと水素を 2 4 対 6 対 7 0 の割合で混合した原料ガスを反応部に供給し、反応部の全体圧力を 1 . 3 k P a に調整した。基板上に移動したホットフィラメントに 0 . 7 A 程度通電して、フィラメント温度を 4 0 0 ∞ 程度にした。この状態を 1 5 9 間維持した後通電を停止し、反応部内の残留原料ガスを排気してから基板を取り出した。図 3 (b) に示したように、基板面から垂直方向に長さ約 2μ m、直径約 1 5 n mのカーボンナノチューブ 3 6 が形成された。

[0028]

(実施例3)

÷,

図4(a)に示したように、ガラス基板40上に溶液反応法により直径4nm程度のFePt微粒子の膜42を形成した。溶液反応であるため、FePt微粒子の周りはカーボン等の不純物で覆われている。通常500℃以上の熱処理でほとんどの不純物は蒸発してなくなるが、FePt微粒子をカーボンナノチューブ成長用の触媒として使用するのには、それだけでは十分でない。そこで、反応部に基板を入れてから水素を導入して圧力を1kPaに制御し、500℃でアニール処理して、FePt微粒子を完全にクリーニングした。

[0029]

次に、水素とアセチレンとアルゴンの95対1対4の混合ガスを反応部に供給し、反応部の全体圧力を1 k P a に設定した。500 $\mathbb C$ に加熱した基板上に移動したホットフィラメントに10 A 通電して10 分間維持した。図4 (b) に示したように、基板面から垂直方向に長さ約 2μ m、直径約8n mのカーボンナノチューブ44 が形成された。

[0030]

本発明は、以上説明したとおりであるが、その特徴を種々の態様ととも付記すれば、次のとおりである。

(付記1) 成長室内に基材を配置し、原料ガスを供給してCVD法により基材上にカーボンナノチューブを配向成長させる方法であって、カーボンナノチュー

ر

ブの成長に、電界及びプラズマのいずれも用いず、且つ成長室内に配置したフィラメントの発する熱を利用することを特徴とするカーボンナノチューブ成長方法。

- (付記2)カーボンナノチューブ成長時の前記フィラメントの温度を400℃ 以上とする、付記1記載のカーボンナノチューブ成長方法。
- (付記3)前記フィラメントとしてレニウム製又はレニウムを主成分とする材料製のフィラメントを使用する、付記1又は2記載のカーボンナノチューブ成長方法。
- (付記4)前記原料ガスとして、炭素源のガスを使用する、付記1から3までのいずれか一つに記載のカーボンナノチューブ成長方法。
- (付記5)前記炭素源として、炭化水素、アルコール又はそれらの混合物を使用する、付記4記載のカーボンナノチューブ成長方法。
- (付記6)前記炭化水素がメタン、エタン、アセチレン、プロパン、ブタン又はそれらの2種以上の混合物である、付記5記載のカーボンナノチューブ成長方法。
- (付記7)前記アルコールがメタノール、エタノール又はそれらの混合物である、付記5記載のカーボンナノチューブ成長方法。
- (付記8)前記原料ガスが、反応性ガスと不活性ガスの一方又は両方を更に含む、付記4から7までのいずれか一つに記載のカーボンナノチューブ成長方法。
- (付記9)前記反応性ガスが水素である、付記8記載のカーボンナノチューブ 成長方法。
- (付記10) 前記不活性ガスがヘリウム又はアルゴンである、付記8記載のカーボンナノチューブ成長方法。
- (付記 11)成長室内における前記原料ガスの全圧を $0.1 \sim 1.00$ k P a と する、付記 1 から 10 までのいずれか一つに記載のカーボンナノチューブ成長方法。
- (付記12) 基材表面に形成した薄膜又は微粒子状のカーボンナノチューブ成長触媒を使用する、付記1から11までのいずれか一つに記載のカーボンナノチューブ成長方法。

(付記13) 前記触媒として前記微粒子状の触媒を使用し、その直径により成長するカーボンナノチューブの直径を制御する、付記12記載のカーボンナノチューブ成長方法。

(付記14)カーボンナノチューブの成長前に、前記基材上に形成した前記微粒子状の触媒を前記成長室内において反応性ガスの存在下でアニール処理して、微粒子状触媒から不純物を除去する、付記13記載のカーボンナノチューブ成長方法。

(付記15) 前記触媒が、カーボンナノチューブ成長触媒となり得る遷移金属のFe、Ni、Co、Pd又はそれらの2種以上の合金である、付記12から14までのいずれか一つに記載のカーボンナノチューブ成長方法。

(付記16) 前記触媒がカーボンナノチューブ成長触媒となり得る遷移金属と触媒とならない金属との合金である、付記12から14までのいずれか一つに記載のカーボンナノチューブ成長方法。

(付記17)前記合金がFe-Pt又はCo-Pt合金である、付記16記載のカーボンナノチューブ成長方法。

(付記18) カーボンナノチューブ成長時に前記フィラメントと前記基材の一方又は両方を相対的に移動させる、付記1から17までのいずれか一つに記載のカーボンナノチューブ成長方法。

(付記19) 前記基材が半導体又はガラス基板である、付記1から18までのいずれか一つに記載のカーボンナノチューブ成長方法。

(付記20)カーボンナノチューブ成長時の前記基材の成長面温度を600℃ 以下とする、付記1から19までのいずれか一つに記載のカーボンナノチューブ 成長方法。

[0031]

【発明の効果】

本発明によれば、これまで使用されてきた電界あるいはプラズマ等の補助的手段に頼ることなく、低温で基材上に配向成長したカーボンナノチューブを得ることができる。

【図面の簡単な説明】

本発明のカーボンナノチューブ成長方法を説明する模式図である。

【図2】

実施例1のカーボンナノチューブの成長を説明する図である。

【図3】

実施例2のカーボンナノチューブの成長を説明する図である。

【図4】

実施例3のカーボンナノチューブの成長を説明する図である。

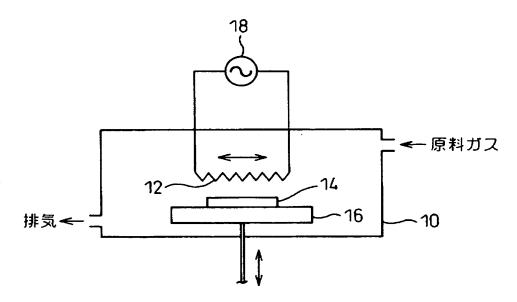
【符号の説明】

- 10…真空チャンバ
- 12…ホットフィラメント
- 14…成長基材
- 16…基材ステージ
- 20、30…シリコン基板
- 2 2 ···N i 薄膜
- 2 4 、 3 4 ··· S i N 絶縁膜
- 26、36、44…カーボンナノチューブ
- 3 2 … F e 微粒子膜
- 40…ガラス基板
- 4 2 ··· F e P t 微粒子膜

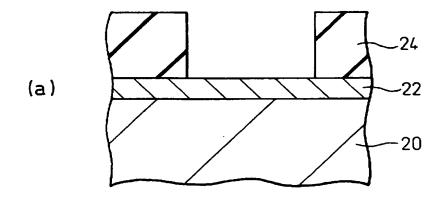
【書類名】

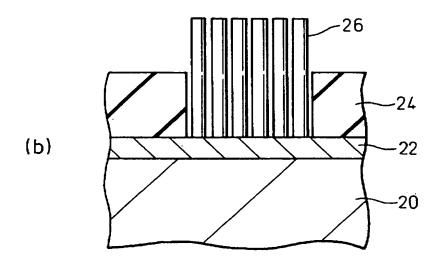
図面

【図1】

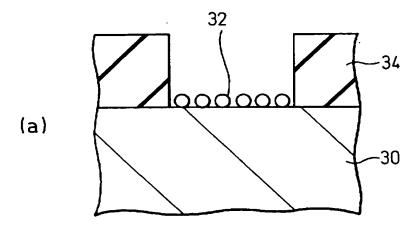


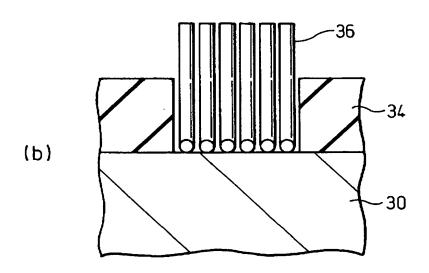
【図2】



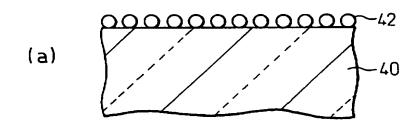


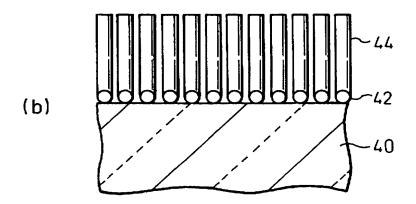
【図3】





【図4】





1/E

【書類名】 要約書

【要約】

Z,

【課題】 これまで使用されてきた電界あるいはプラズマ等の補助的手段に頼ることなく、低い温度で配向成長したカーボンナノチューブを製造できる新しい方法を提供すること。

【解決手段】 成長室10内に基材14を配置し、原料ガスを供給してCVD法により基材14上にカーボンナノチューブを配向成長させる方法であって、カーボンナノチューブの成長に、電界及びプラズマのいずれも用いず、且つ成長室内に配置したフィラメント12の発する熱を利用する方法とする。好ましくは、カーボンナノチューブ成長時のフィラメント温度を400℃以上とし、そしてレニウム製又はレニウムを主成分とする材料製のフィラメントを使用する。

【選択図】 図1

特願2003-083192

出願人履歴情報

識別番号

[000005223]

1. 変更年月日 [変更理由] 1996年 3月26日

住 所

住所変更

氏 名

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号

富士通株式会社